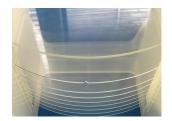




本公司對射型-晶圓掃描(thrughbeam映射感測器)提供低成本可靠的晶圓掃描,可檢測晶圓在插槽中的位置錯誤。



適用於不同尺寸、資料和塗層的晶圓。可用 於檢測低反射率、透明和薄、彎曲的晶圓, 滿足小間距的使用要求。亦可用於因為晶圓 由於搬運造成初始位置改變時(小於3mm) 的場所。位置感測器(存在感測器)提供監 控晶片的存在,以加强晶圓傳送安全。





不限晶圓尺寸、厚度、彎曲和資料 可用於檢測低反射率、透明和薄、彎曲的晶圓, 矽、藍寶石、玻璃和複合片

我們的感測器可以單獨出售,也可以集成到 邊緣夾持器或真空夾持器(Endeffctor)中 出售,滿足小空間的使用要求(Small foot-

- * Accurately detects empty slots and cross slotted or double slotted wafers
- 準確檢測空槽、交叉槽或雙槽中的晶圓
- * Requires minimal wafer engagement < 3mm from wafer edge

最小晶圓佔用範圍(從晶圓邊緣起<3mm)

- * Class one laser 等級1電射
- *Immune to ambient light 不受環境光影響
- * Any wafer size, thickness, warpage or substrate material

不限晶圓尺寸、厚度、彎曲和資料

- * Available for a variety of applications (e.g. integrated in end effectors)
- 多種應用 (可集成到末端執行器)
- * Bridge applications for 125-150mm, 150-200mm, and 200-300mm.

測量範圍: 125-150mm 150-200mm, 和 强度。



對射式掃描感測器

50-0012掃描感測器, 對射, 50 mm 50-0014掃描感測器, 對射, 100 mm

50-0015掃描感測器,對射,125mm-150mm 50-0016掃描感測器,對射,150mm-200mm

50-0017掃描感測器, 對射, 300mm



帶前段掃描功能的渦流邊緣夾持器

渦流邊緣夾持器, U型, 帶前端對射光學感測器



帶前段掃描功能的邊緣夾持器

邊緣夾持器,自動對心,"鏟"型,前段對射光學感測器



帶側面掃描功能的邊緣夾持器

邊緣夾持器,自動對心,"鏟"型,側面對射光學感測器



帶前段掃描功能的真空末端夾持器

真空末端夾持器, 採用對射光學感測器



帶前段掃描感測器和位置感測器的重力末端執行器

重力夾持末端執行器採用前段光學掃描感測器和位置感測器

基本參數

晶圓尺寸	50mm, 100mm, 125-150mm, 150-200mm和200-300mm	功率	0.3mW
		波長	680nm
晶圓資料	薄、厚或彎曲 矽、藍寶石、玻璃和複合片	偏差	~1.5°
		安全	Class 1A
光學調製頻率	7kHz	電源	24 V DC, 45mA

QUARTET MECHANICS INC.

email: inquiry@quartetmechanics.com / www.quartetmechanics.com 4055 Clipper Court, Fremont, CA 94538, USA < P +1.510.490.1886 / F +1.510.490.1887

